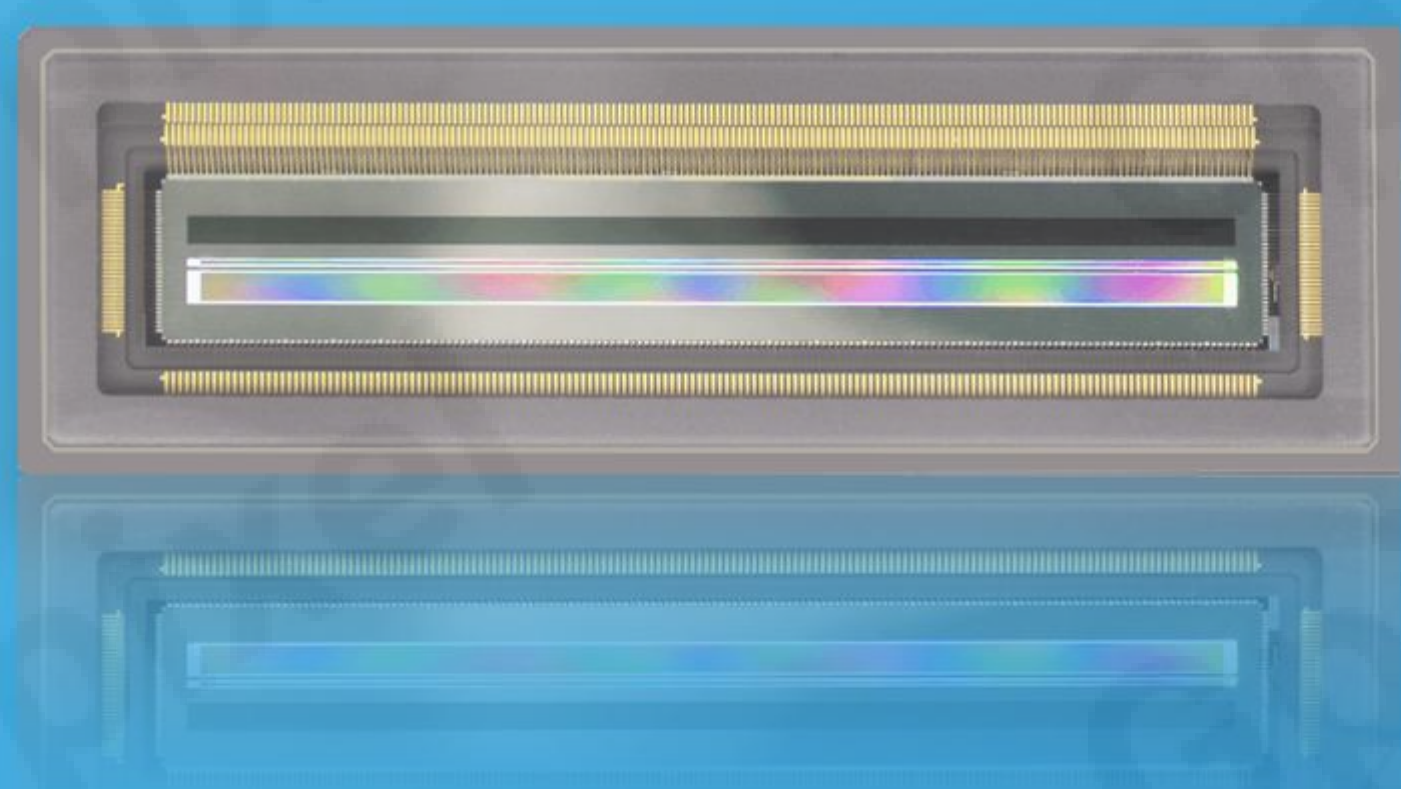


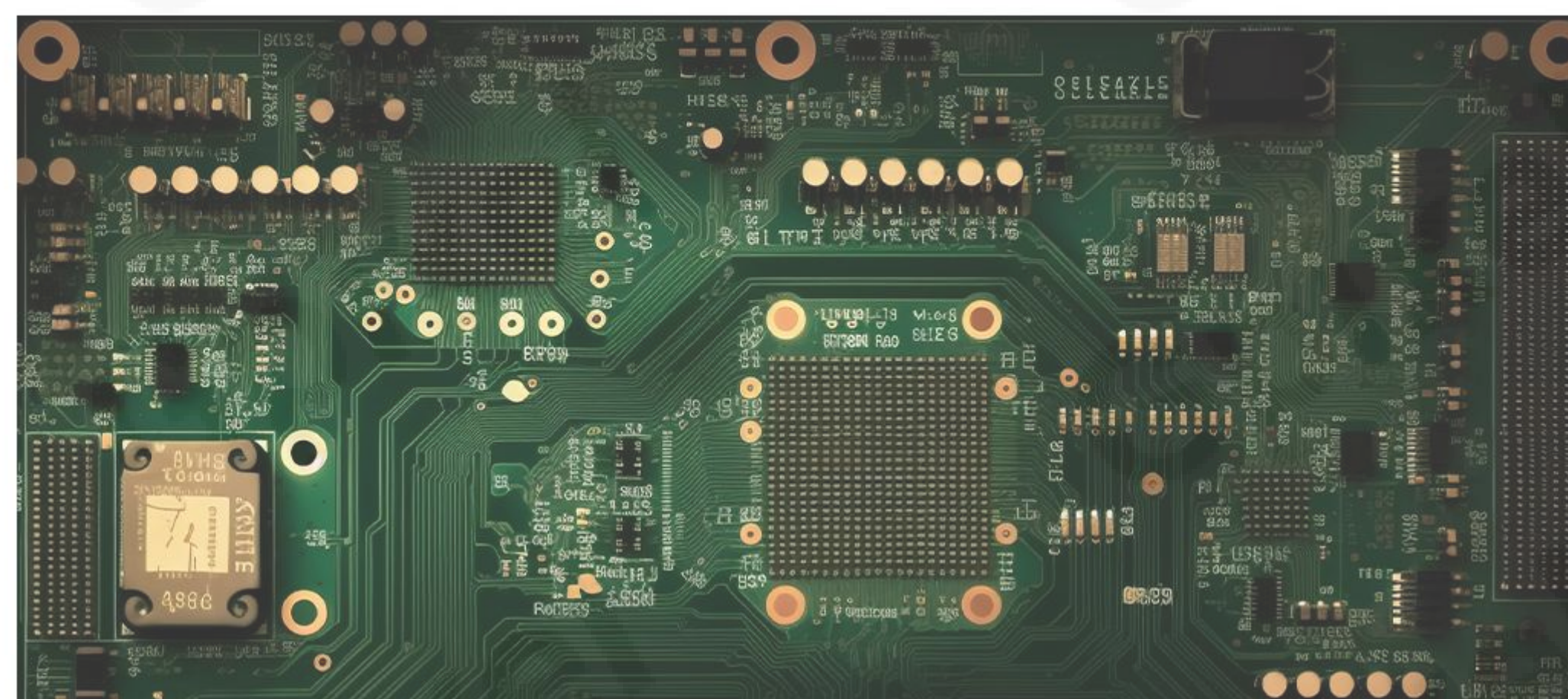
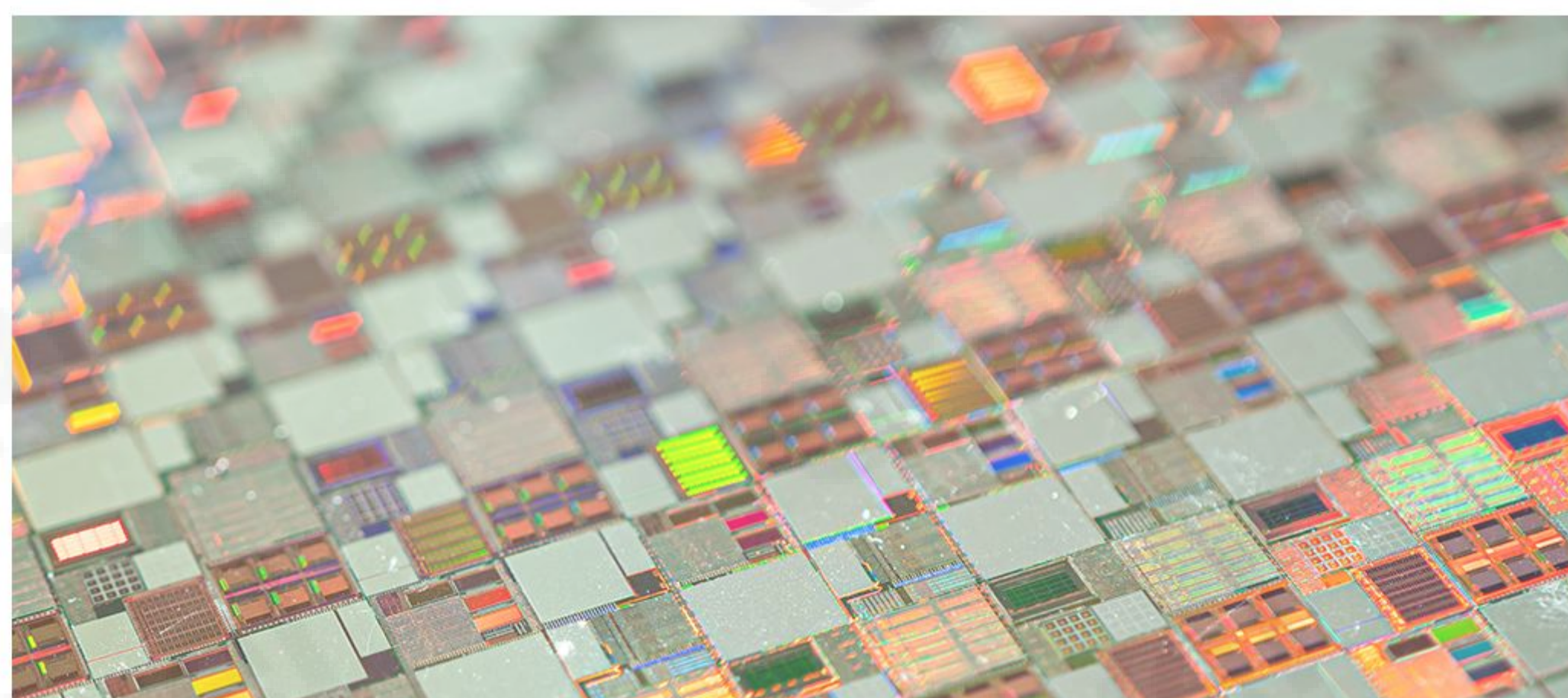


GLT5009BSI

9K背照式CMOS TDI图像传感器

GLT5009BSI是一款背照式电荷域时间延时积分(TDI)CMOS图像传感器。**GLT5009BSI**像素尺寸为 $5\ \mu\text{m}$, 横向分辨率为9072,级数达到256级。结合先进的背照式工艺,使其具有极高的灵敏度,以满足在高速、弱光环境下的检测需求。**GLT5009BSI**具有 $16\ \text{ke}^-$ 的满阱容量以及小于 $8\ \text{e}^-$ 的读出噪声,动态范围可达68.7 dB。芯片集成两个谱段,分别为256级和32级,在双谱段工作模式下,可进行HDR合成,动态范围可达77.5 dB。该芯片采用84对Sub-LVDS输出,最大数据速度可达74.304 Gbps。芯片支持多种工作模式,10 bit输出时最高行频可达608 kHz,12 bit输出时最高行频为300 kHz。**GLT5009BSI**采用了269 pins μPGA 陶瓷封装,同时片上集成时序生成器、LVDS通道合并、双向扫描等功能,使得用户的相机设计更加简单。

GLT5009BSI 提供标准版本和深紫外增强版本。



产品特性及优势

- ▶ 背照式
- ▶ TDI
- ▶ 高灵敏度
- ▶ 最高行频: 608 kHz (10 bit)
- ▶ 双谱段HDR
- ▶ $\text{QE} \geq 50\%$ (266 nm)

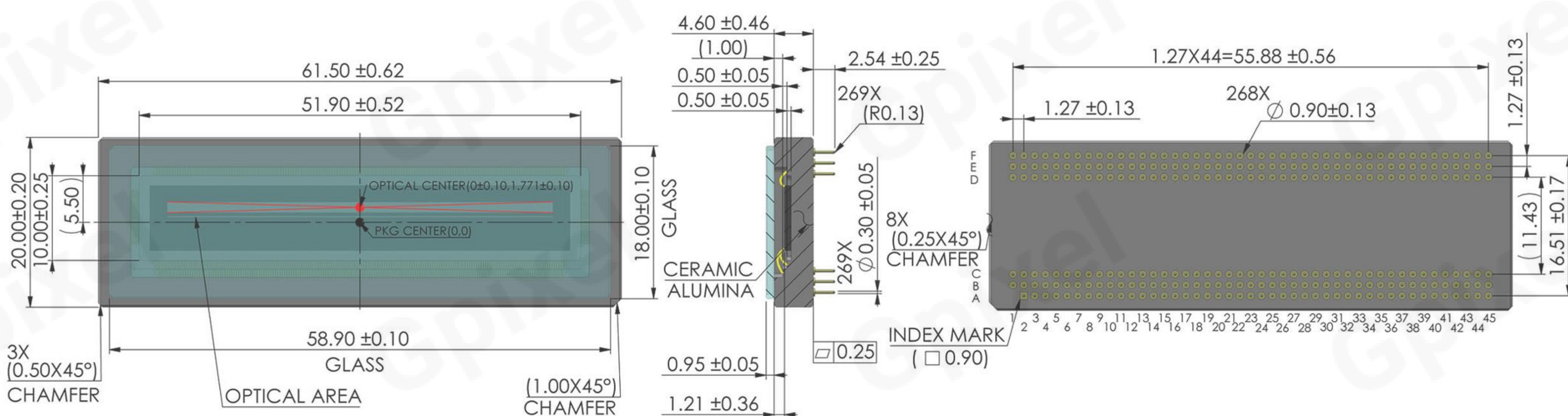
应用领域

- ▶ 工业检测
- ▶ 半导体检测
- ▶ 荧光成像
- ▶ 医疗成像

规格参数

有效分辨率	P1:9072(H) pixels x 256(V) stages P2:9072(H) pixels x 32(V) stages	感光面长度	45.36 mm
像素尺寸	5 μm x 5 μm	满阱容量	16.3 ke ⁻ (10 bit,single band) 19.2 ke ⁻ (12 bit,single band)
读出噪声	10.6 e ⁻ (10 bit,single band) 7.0 e ⁻ (12 bit,single band)	动态范围	63.7 dB (10 bit,single band) 68.7 dB (12 bit,single band)
暗电流	~ 4 ke ⁻ /s/pixel (30°C)	峰值量子效率	82.4% (550 nm)
ADC	10/12 bit	最高行频	608 kHz (10 bit,single band) 300 kHz (12 bit,single band)
电荷转移效率 (CTE)	≥ 0.99993	输出接口	84对Sub-LVDS
通道合并	84/42/21/12/6/3	最大数据率	74.304 Gbps
色彩	黑白,黑白(UV)	功耗	< 5.8 W (300 kHz line rate)
供电电压	5 V(模拟),1.8 V(ADC) 1.8 V(数字)	封装形式	μPGA 269 pins (61.5 mm x 20.0 mm)

封装信息



联系方式

长春(总部)

长春长光辰芯微电子股份有限公司
吉林省长春市经开区自由大路7691号
光电信息产业园一期1号、5号办公楼
电话：0431-85077785

杭州

杭州长光辰芯微电子有限公司
浙江省杭州市滨江区月明路567号
滨芯科技园D座
电话：0571-87718606

大连

大连长光辰芯微电子有限公司
辽宁省大连市高新技术产业区
汇贤园7号11楼05D室
电话：0411-39937666



免责声明：本彩页所涉及的产品信息及图片仅供参考，由于产品不断更新，最终请以实物为准。长光辰芯保留本产品彩页的最终解释、修订权利。
GP-PR260826 V1.1

✉ info@gpixel.com

 www.gpixel.com